

## X射线质量衰减截面和光电截面的高精度测量

王大椿

北京师范大学低能核物理所; 北京市辐射中心

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

### 摘要

利用特征X射线源系统地测量了Si、Fe、Cu、Y、In、Sn等六种元素及SiH<sub>4</sub>的X射线质量衰减系数, 实验误差为±1%。

By using the characteristic X ray sources and the Si(Li) detector system, the X ray mass attenuation coefficients for Si, Fe, Cu, Y, In, Sn and SiH<sub>4</sub> have been systematically measured in the energy range of 1.486~29.109 keV. The accuracy of experimental data has been reduced to ±1%.

关键词 [X射线](#) [质量吸收系数](#) [光电截面](#) [衰减截面](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 王大椿

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(101KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“X射线”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [王大椿](#)